

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2024684516

**Программа контроля дефектов полупроводниковых  
пластин в фотолитографии при технологии  
изготовления 350 нм с использованием CNN нейросети**

Правообладатель: **Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Воронежский государственный технический  
университет» (RU)**

Авторы: **Чирков Олег Николаевич (RU), Тамбовцев Максим  
Николаевич (RU)**

Заявка № 2024683496

Дата поступления **10 октября 2024 г.**

Дата государственной регистрации

в Реестре программ для ЭВМ **17 октября 2024 г.**



*Руководитель Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат 0692e761a6300bf54f240f670bca2026  
Владелец **Зубов Юрий Сергеевич**  
Действителен с 10.07.2024 по 03.10.2025

*Ю.С. Зубов*